



BIML 04 N° 1014/JFM-PSt-G

2004.11.29

**To:** Manufacturers of measuring instruments  
OIML Issuing Authorities

**Subject:** International Metrology Congress, Lyon, France, June 2005

Dear Sir, dear Madam,

It is our pleasure to confirm that the 40<sup>th</sup> CIML Meeting will be organized in conjunction with the International Metrology Congress in Lyon, France, next June.

This Congress, which usually gathers together about 600 metrologists from research, laboratories and industry from about 25 countries, is co-organized this year with the OIML on the occasion of the 50<sup>th</sup> anniversary of our Organization. It will benefit from the participation of delegates from the International Committee of Legal Metrology (59 Member States and 50 Corresponding Members from all parts of the world).

Two special sessions on Legal Metrology will be organized in this Congress, and a number of other sessions will present issues of interest for legal metrology.

Together with this Congress, an exhibition is organized for manufacturers of equipment, laboratories, certification bodies and other services to industry.

The Congress and exhibition are a unique opportunity for you to meet those in charge of Legal Metrology from all countries, to show your products and to obtain information about the conditions of accessing markets subject to metrological regulations. Until now, there have been no similar occasions to organize such contacts at a worldwide level.

We invite you to consult the web site of the organizers of this Congress (<http://www.cfmetrologie.com/>), and to participate in this Congress and in the exhibition.

Hoping to meet you in Lyon,

Yours faithfully,

J.F. Magaña  
BIML Director



BIML 04 N° 1014/JFM-PSSt-G

2004.11.29

**Aux:** Fabricants d'instruments de mesure  
Autorités de Délivrance de l'OIML

**Objet :** Congrès International de Métrologie, Lyon, France, juin 2005

Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de confirmer que la prochaine réunion du CIML sera organisée en conjonction avec le Congrès International de Métrologie à Lyon, en juin prochain.

Ce Congrès, qui rassemble habituellement environ 600 métrologues de la recherche, de laboratoires et de l'industrie d'environ 25 pays, est co-organisé cette année avec l'OIML à l'occasion du 50<sup>ème</sup> anniversaire de notre Organisation. Il bénéficiera de la participation des délégués du Comité International de Métrologie Légale (59 Etats Membres et 50 Membres Correspondants de toutes les régions du monde).

Deux sessions spéciales sur la métrologie légale seront organisées dans ce Congrès, et un certain nombre d'autres sessions présenteront des sujets intéressant la métrologie légale.

En accompagnement de ce Congrès, une exposition est organisée pour les fabricants d'équipements, les laboratoires, les organismes de certification et les autres services à l'industrie.

Ce Congrès et cette exposition sont une opportunité unique pour vous, de rencontrer des responsables de la métrologie Légale de tous les pays, de montrer vos produits et d'obtenir des informations sur les conditions d'accès aux marchés soumis à des réglementations métrologiques. Jusqu'ici il n'y avait pas eu d'occasions similaires d'organiser de tels contacts au plan mondial.

Nous vous invitons à consulter le site web des organisateurs de ce Congrès (<http://www.cfmetrologie.com/>) et à participer à ce Congrès et à cette exposition.

Espérant vous rencontrer à Lyon,

Meilleures salutations,

J.F. Magaña  
Directeur du BIML